

ナノテク産業化基盤技術の有効利用および 高度化と融合を目指した研究会2017

収差補正走査/透過電子顕微鏡の出現によって像分解能及び分析の空間分解能が向上しただけでなく、新規な結像技術によって多種多様な情報が入手できるようになりました。

今回はこれらの新しい手法を紹介する機会を設けました。この他に、特別講演として企業の研究者から“材料の微細構造解析に関わる話題”を提供していただきます。

皆様奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。

参加費：無料

日時

2017年
3月10日 金 13:00-17:45

場所

九州大学
伊都ゲストハウス
(福岡市西区元岡744)

主催：九州大学 超顕微解析研究センター， 文科省 微細構造解析プラットフォーム
九州大学 学術研究都市推進機構 (OPACK)

後援：日本エフイー・アイ(株)， 日本電子(株)， (株)日立ハイテクノロジーズ

プログラム

1. センター長挨拶
2. DPC STEM を用いた材料解析 (DPC: Differential Phase Contrast)
柴田 直哉 (東京大学大学院工学系研究科 総合研究機構)
3. Expanding STEM capabilities with segmented and pixelated detectors
アレクサンダー ブライト (日本エフイー・アイ (株))
4. STEMモアレ法による低ドーズ下での擬原子カラム元素マップ
近藤 行人 (日本電子 (株))

休憩

5. 収差補正STEM観察のための低損傷試料作製
佐藤 高広 ((株)日立ハイテクノロジーズ)
6. 特別講演
企業における材料の研究開発と文科省微細構造解析プラットフォームへの期待
添田 武志 ((株)富士通研究所)
7. 九州大学学術研究都市づくりの取り組みについて
岩重 英治 ((公財)九州大学学術研究都市推進機構)
8. 九州大学における微細構造解析プラットフォームの利用状況
品野 俊治 (九州大学超顕微解析研究センター)

技術交流会 学内レストラン「天天」 18:00-19:30